



**PREMIÈRE
MINISTRE**

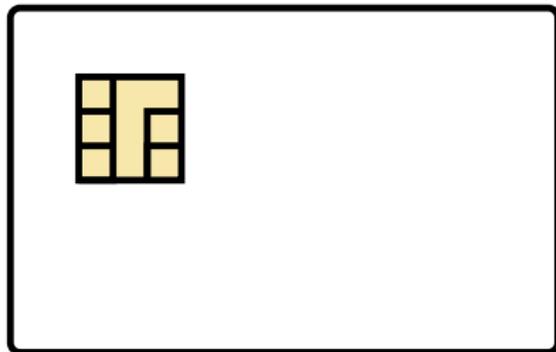
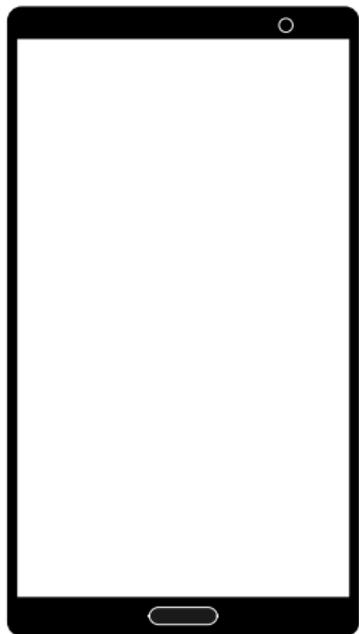
*Liberté
Égalité
Fraternité*



Étude de cas : attaques par canaux auxiliaires

Thomas TROUCHKINE
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

Vérification de code PIN





```
bool verifyPin(char* buf1, char* buf2, unsigned char size){  
    for(unsigned char i=0; i<size; i++){  
        if(buf1[i] != buf2[i])  
            return false;  
    }  
    return true;  
}
```



```
bool verifyPin(char* buf1, char* buf2, unsigned char size){  
    for(unsigned char i=0; i<size; i++){  
        if(buf1[i] != buf2[i])  
            return false;  
    }  
    return true;  
}
```

Vérification de code PIN



```
bool verifyPin(char* buf1, char* buf2, unsigned char size){  
    for(unsigned char i=0; i<size; i++){  
        if(buf1[i] != buf2[i])  
            return false;  
    }  
    return true;  
}
```

Boucle avec un temps d'exécution variable



```
bool verifyPin(char* buf1, char* buf2, unsigned char size){  
    for(unsigned char i=0; i<size; i++){  
        if(buf1[i] != buf2[i])  
            return false;  
    }  
    return true;  
}
```

Boucle avec un temps d'exécution variable

Temps d'exécution dépend du nombre de valeurs identiques

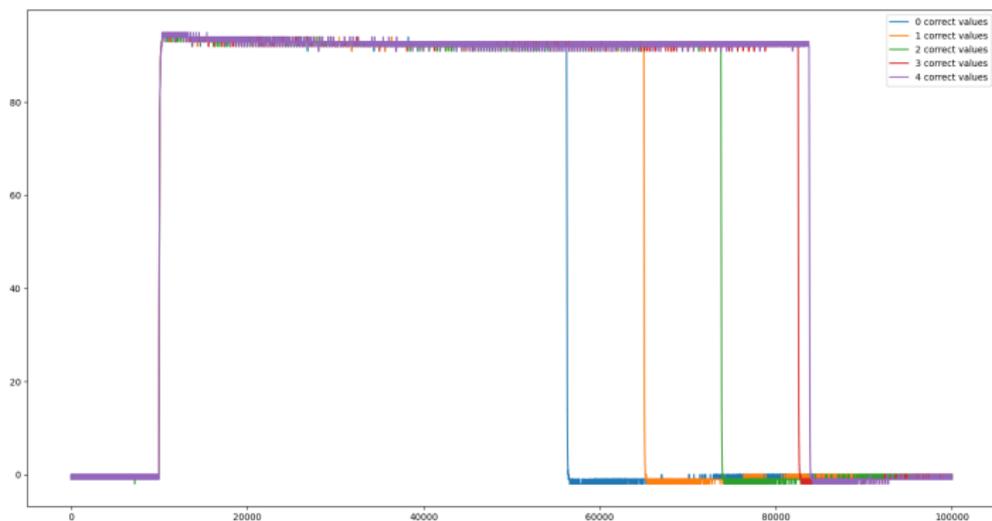


Démonstration

(Fuite en temps)

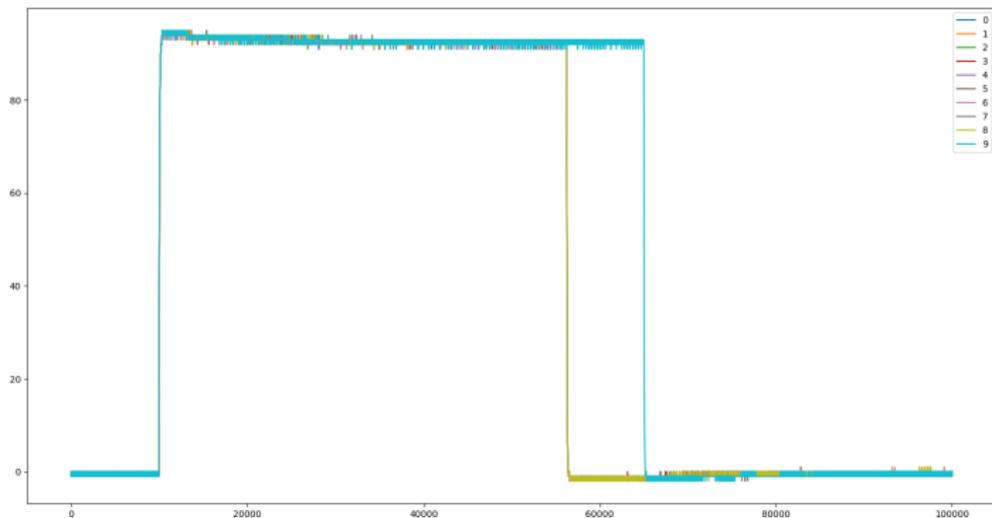


Signal de trigger en fonction du nombre de valeurs correctes dans le PIN





Signal de trigger en fonction de la première valeur du PIN





Démonstration

(Attaque complète)



Démonstration

(Sans signal de trigger depuis la carte attaquée)



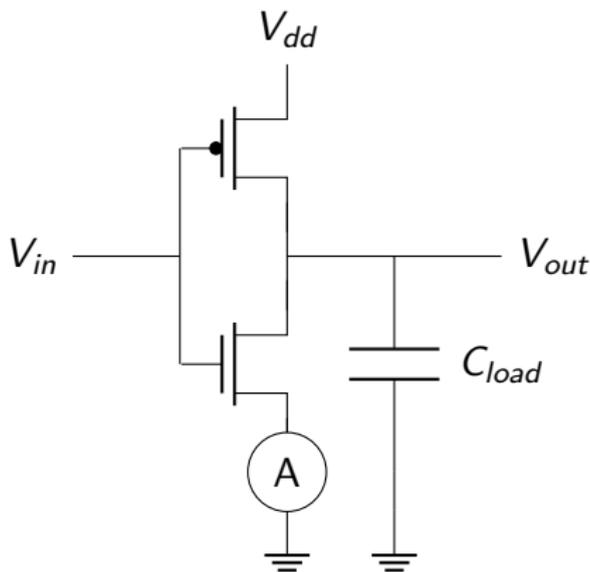
Démonstration

(Sans signal de trigger depuis la carte attaquée)

Échec

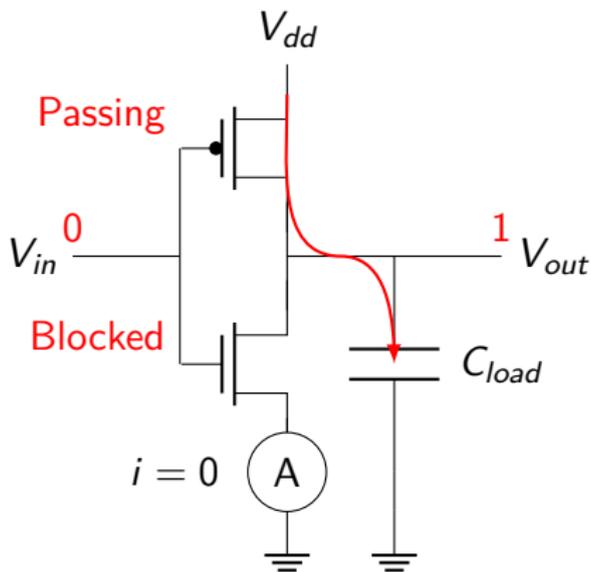


La consommation en énergie d'un circuit dépend des données qu'il manipule



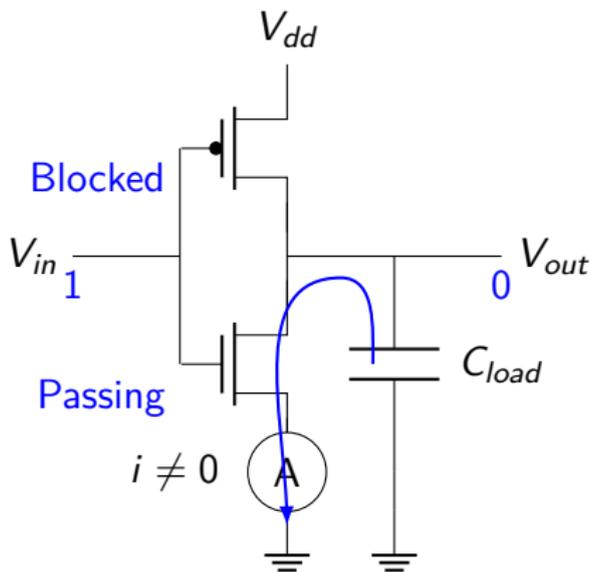


La consommation en énergie d'un circuit dépend des données qu'il manipule



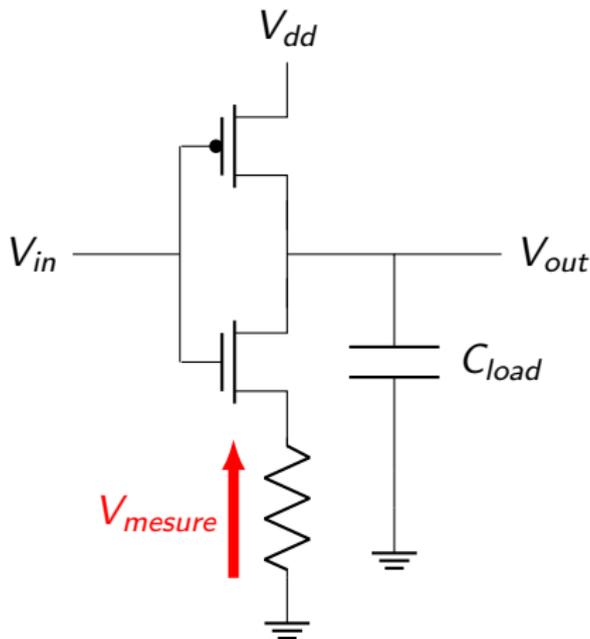


La consommation en énergie d'un circuit dépend des données qu'il manipule





La consommation en énergie d'un circuit dépend des données qu'il manipule





- On mesure la tension générée par l'ensemble des transistors du circuit
- De manière générale la tension observée peut s'exprimer telle que :

$$V_{obs} = F(d) + B$$

où



- On mesure la tension générée par l'ensemble des transistors du circuit
- De manière générale la tension observée peut s'exprimer telle que :

$$V_{obs} = F(d) + B$$

où

- d représente les données (ici la valeur du code PIN) qui nous intéresse



- On mesure la tension générée par l'ensemble des transistors du circuit
- De manière générale la tension observée peut s'exprimer telle que :

$$V_{obs} = F(d) + B$$

où

- d représente les données (ici la valeur du code PIN) qui nous intéresse
- F est la fonction qui modélise l'impact de d sur la tension observée



- On mesure la tension générée par l'ensemble des transistors du circuit
- De manière générale la tension observée peut s'exprimer telle que :

$$V_{obs} = F(d) + B$$

où

- d représente les données (ici la valeur du code PIN) qui nous intéresse
- F est la fonction qui modélise l'impact de d sur la tension observée
- B est le bruit lié au fonctionnement général du circuit
 - $B = C \pm R$ où C est la valeur nominale de consommation du circuit et R des fluctuations aléatoires liées au fonctionnement du circuit/environnement



Principe de l'attaque

- On veut distinguer le bon PIN des mauvais PIN
- En moyenne le bon PIN aura une consommation :
$$\tilde{V}_{obs}(PIN_{correct}) = \tilde{F}(PIN_{correct}) + C$$
- En comparant cette trace de consommation moyenne avec celle obtenue en testant tous les PIN, on aura:
 - $\tilde{V}_{obs}(PIN_{test}) - \tilde{V}_{obs}(PIN_{correct}) = 0$ pour le bon PIN
 - $\tilde{V}_{obs}(PIN_{test}) - \tilde{V}_{obs}(PIN_{correct}) \neq 0$ pour les mauvais PIN

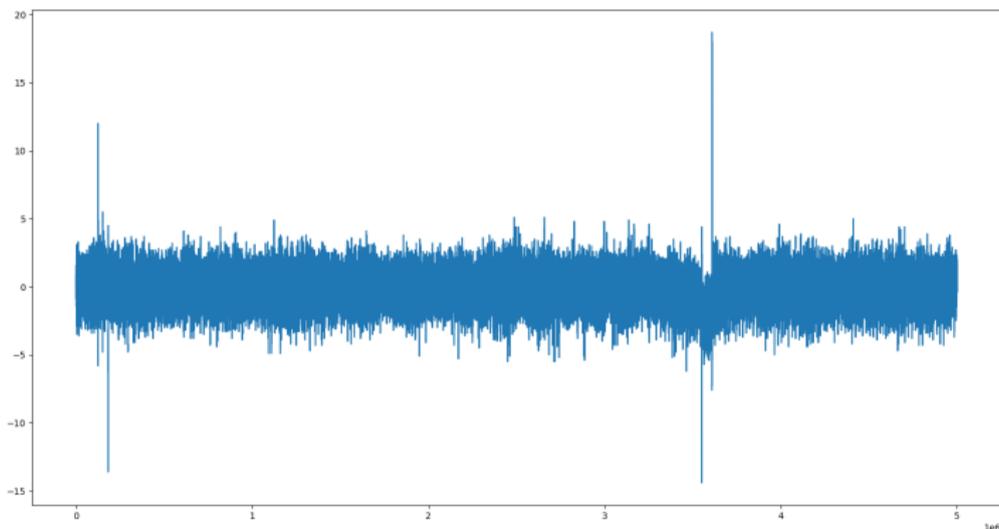


Démonstration

(Fuite en courant)



Différence de la consommation moyenne du circuit entre le bon PIN et le mauvais PIN (1ère valeur)





Problème : On a besoin d'une trace de référence avec le bon PIN



Problème : On a besoin d'une trace de référence avec le bon PIN

- On a accès à un composant similaire sur lequel faire des acquisitions : Attaque par templating



Problème : On a besoin d'une trace de référence avec le bon PIN

- On a accès à un composant similaire sur lequel faire des acquisitions : Attaque par templating
- On simule les traces sur ordinateur : Attaque par corrélation



Contre les fuites temporelles : fonction en temps constant

```
bool verifyPin(char* buf1, char* buf2, unsigned char size){  
    bool pinOk = true;  
    for(unsigned char i=0; i<size; i++){  
        if(buf1[i] != buf2[i])  
            pinOk = false;  
    }  
    return pinOk;  
}
```



Contre les fuites temporelles : fonction en temps constant

```
bool verifyPin(char* buf1, char* buf2, unsigned char size){  
    bool pinOk = true;  
    for(unsigned char i=0; i<size; i++){  
        if(buf1[i] != buf2[i])  
            pinOk = false;  
    }  
    return pinOk;  
}
```

Boucle toujours en temps variable !



Contre les fuites temporelles : fonction en temps constant

```
bool verifyPin(char* buf1, char* buf2, unsigned char size){  
    bool pinOk = true;  
    bool dummy = false;  
    for(unsigned char i=0; i<size; i++){  
        if(buf1[i] != buf2[i])  
            pinOk = false;  
        else  
            dummy = false;  
    }  
    return pinOk;  
}
```

Questions?